

EML T0 老化测试系统

PSS EMLBI21536/EMLBI11536



产品简介

PRODUCT INTRODUCTION

普赛斯 EML T0 集成式老化测试系统 用于 EML T0 器件的老化筛选以及可靠性寿命分析。系统支持最大 1536 路器件老化，通过外部环境控温或对器件内部 TEC 进行高温控温，为 LD 器件提供恒定电流来实现对 EML 器件的老化，系统可实时显示老化电流、背光电流、正向电压、EA 电流等参数并且图形直观显示，便于用于观察老化过程中的异常情况，通用老化板兼容我司 EML T0 盘测系统，显著提高测试效率和 T0 产品质量。

产品应用

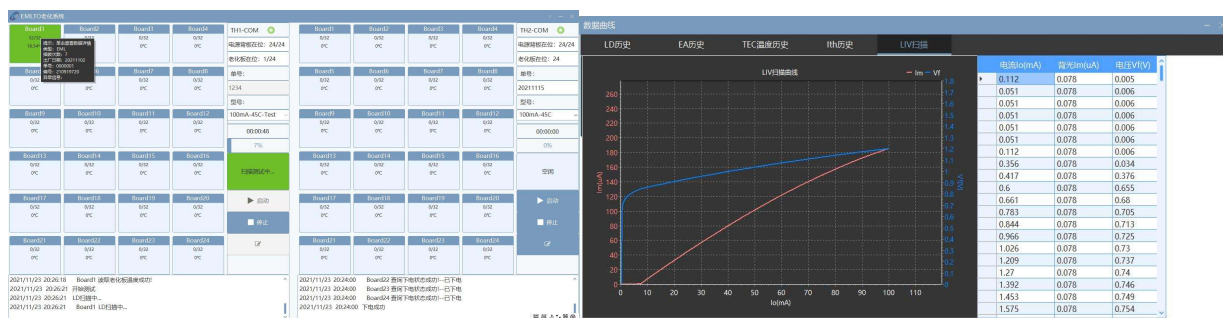
PRODUCT APPLICATION

- 批量生产环节中 EML T0 器件进行老化筛选
- 长时间可靠性失效测试分析

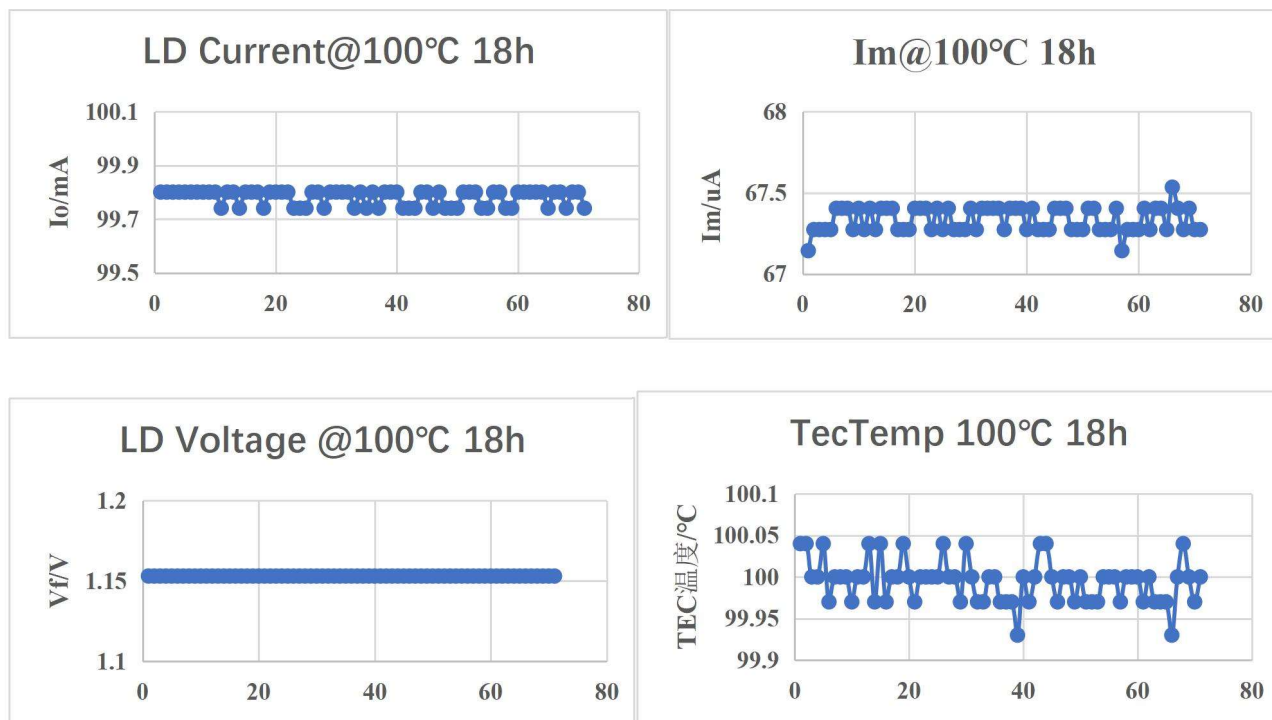
产品特点

PRODUCT FEATURES

- 硬件支持 SOA 供电，完美兼容带 PD 或 SOA 的 EML 激光器
- 支持 Im 扫描计算 Ith



- 32 路老主板作为通用载体，可以实现盘测、老化不同工位直接的转料，提高生产效率
- 每块老主板可配置不同参数进行老化，老化参数稳定可靠



- 支持热插拔，完善的 EOS 防护，保证器件老化期间安全



技术参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| 参数 | 指标 |
|----------|--|
| 老化规模 | 1536 |
| LD 驱动电流 | 0~250mA |
| SOA 驱动电流 | 0~250mA |
| PD 反偏电压 | 0~5V |
| LD 正向电压 | 0~5V |
| LD 监控电流 | 0~250mA |
| SOA 监控电流 | 0~250mA |
| PD 监控电流 | 0~2000uA |
| EA 电压 | 0~-5V |
| EA 电流 | 0~200mA |
| LIV 扫描 | 支持 Im 扫描计算 Ith |
| 温控方式 | 支持外部环境控温和 TEC 控温 |
| TEC 电流范围 | -1A~+1A |
| 温控范围 | 环境温度控温:RT+20°C~150°C 器件内部 TEC 控温:RT~130°C |
| 温度稳定性 | ±0.5°C |
| 数据库 | 系统自带 SQL 数据库, 可以追述保存 LD 测试的数据 |
| 电源规格 | AC 380V/50HZ |
| 功率 | AC 380V 7000W |